

ICS 29.045
H 21



中华人民共和国国家标准

GB/T 16595—1996

晶片通用网格规范

Specification for a universal wafer grid

1996-11-04 发布

1997-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
晶 片 通 用 网 格 规 范
GB/T 16595—1996

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 10 千字
1997年4月第一版 1997年4月第一次印刷
印数 1—1 500

*

书号: 155066·1-13652

*

标 目 308—35

前 言

本标准等效采用半导体设备和材料国际组织 SEMI M17—90《晶片通用网格规范》，结合我国的实际情况制定的，用于定量描述圆形半导体晶片上非均匀分布的表面缺陷。

本标准适用于定量 GB/T 12964、GB/T 14139 中晶片的表面缺陷。

在引用标准中，SEMI M17 中引用的凡已转化成我国标准的国外标准，都引用现行的我国标准。

与本标准配套的规范有 GB/T 16596—1996《确定晶片坐标系规范》。

本标准由中国有色金属工业总公司提出。

本标准由中国有色金属工业总公司标准计量研究所归口。

本标准由中国有色金属工业总公司标准计量研究所负责起草。

本标准主要起草人：吴福立。

本标准 1996 年 11 月首次发布。